Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent und Reexamination	ler
10/530,065	PASQUIER ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Fice R Elbilo	1751	

	SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
8	405	4/13/2007	EE
	406	1	
	408		
	409		
	573		
1	575		
	576	1	
548	146	W	V

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

SEARCH (INCLUDING SEAF		7)
	DATE	EXMR
East	4/13/2007	EE
Inventor name search	4/13/2007	EE
STIC Search Report	4/3/2007	
·		
·		